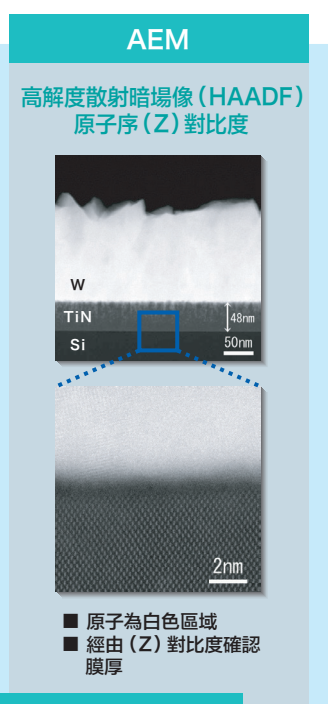
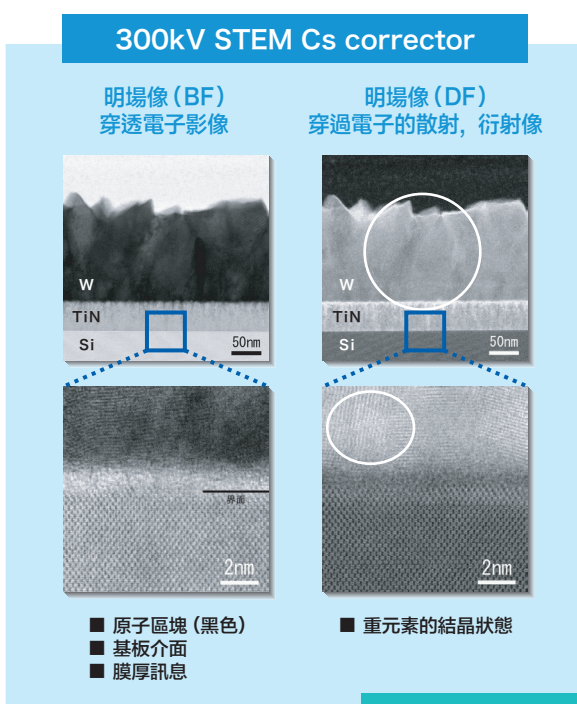
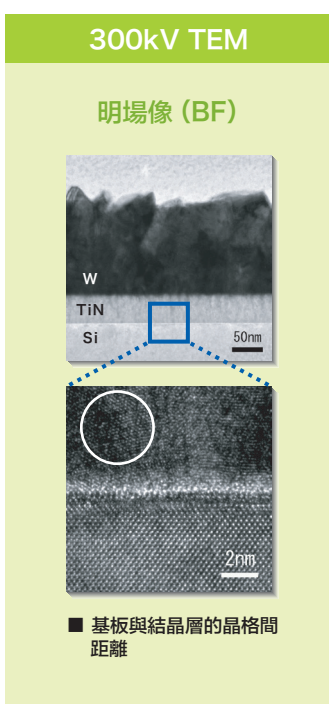


HR STEM

高分解能分析電子顯微鏡觀察

以AEM進行層構造解析

可依不同的目的組成最適切之觀察模式來進行評價。例：高角度環狀暗場像（HAADF）可對 barrier 進行有效評價。



< 評價項目與觀察模式的選擇案例 >

評價項目	TEM	STEM Cs corrector				
		BF	DF	HAADF	EELS	EDX
組成	△	△	×	○	◎ 輕元素	◎ 重元素
界面	△	◎	△	○	×	×
膜厚	○	◎ 結晶性	△	◎ 元素	○ 線分析	○ 線分析
結晶性	◎	○	◎ 重元素	△	×	×
結晶缺陷	◎	○	○	○	×	×

